



中国科学院地球化学研究所

INSTITUTE OF GEOCHEMISTRY CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

求真 奉献 协力 创新



网站首页 研究所概况 研究队伍 研究生教育 院地合作 国际交流 科研成果 学术出版物 科学传播 学会 信息公开 继续教育 党群园地

当前所在位置：首页 >> 新闻动态 >> 综合新闻

清华大学姚文清、李展平高工访问地化所

发布时间：2016-08-03

应月球与行星科学研究中心李雄耀副研究员的邀请，清华大学分析中心姚文清和李展平高级工程师于7月21-24日访问地化所做学术交流，并在矿床室三楼学术报告厅分别做了题为“电子器件的失效机理研究”和“飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)分析技术及其应用”的学术报告，随后在月球与行星科学研究中心会议室参加了月球早期与行星论坛研讨会，报告及研讨会由李雄耀副研究员主持。所内部分科研人员与研究生参加了本次交流会。

在姚文清高工的报告中，详细介绍了电子器件在太空环境中紫外辐射与真空直流电作用下的失效机理研究。电子器件是飞船的基本组成部分，使用磁控溅射的方法在Si片上制备Au/Cu薄膜模拟电子器件结构，并用俄歇电子能谱、X射线光电子能谱仪、原子力显微镜、高分辨电子显微镜等研究它们在紫外辐射和真空直流电作用下Au/Cu界面的扩散和结构的变化。研究表面紫外辐射和直流电引起的热效应是诱导Cu原子向界面扩散的主要因素。同时直流电流下的电子风力也影响了Au/Cu薄膜的界面结构。随后姚文清高工介绍了国家大型科学仪器中心-北京电子能谱的历史及运行现状，并期待与地化所科研人员展开相关合作。



姚文清高工工作报

在李展平高工的报告中，详细介绍了飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)分析技术的发展历史以及它已展开的相关应用。李展平高工将TOF-SIMS与现有的表面分析仪器以及其它种类质谱仪做了详细对比，TOF-SIMS具有高空间分辨率、高灵敏度、分析快、低损耗等优点。针对地化所师生感兴趣的地质学方面的应用，李展平高工也展开的相关介绍，但由于TOF-SIMS高度依赖标准样品，所以在同位素质量分辨率方面还达不到地质学研究要求，不过仍在做相关改进研究工作。报告结束后，与会者积极提问，会场气氛十分活跃。

- 中国科学院地球化学研究所2016年公...
- 7月27日法国国家科学研究院Jacques ...
- 7月28日南京信息工程大学章炎麟教授...
- 7月22日地球早期与行星科学论坛预告...
- 7月21日刘谋斌研究员学术报告预告
- 7月19日美国纽约城市大学王峥嵘教授...
- 7月8日王浩、夏军和许崇育三位院士...
- 7月7日中国科学技术大学吴小平教授...
- 转发《关于举办“地球与行星全国博...
- 2016年度“中德博士后交流项目”(...
- 中科院地化所继续教育培训通知
- 中科院编辑出版序列高级专业技术职...
- 6月15日地化所Acta Geochimica地学...

请输入关键字

- 地球化学研究所举办2016年度人才面...
- 地化所青促会第二期学术沙龙暨第四...
- 美国纽约城市大学王峥嵘教授访问地化所
- 王浩、夏军、许崇育三位院士访问地化所
- 昆明分院信息化工作研讨会在贵阳召开
- 中国科学技术大学吴小平教授访问地化所
- 加拿大阿尔伯塔大学Jeremy P. Richa...
- 地化所《火星科学概论》讨论课开课
- 地化所合唱团荣获第三届中国民歌合...
- 地化所机关一党支部开展“两学一做...
- 地化所环境室党支部积极开展“两学...
- 澳大利亚CSIRO矿产资源所Anais Page...
- 德国地理研究中心Daniel Harlov教授...





李展平高工作报告

在随后的月球早期与行星论坛研讨会中，李雄耀副研究员向姚文清和李展平两位老师介绍了月球与行星科学研究中心的概况、并做了CE-5样品采集和相关科学问题报告，随后李阳、万泉、莫冰、余雯、吴焱学等科研人员也做了相关汇报，与会人员交流讨论热烈。会后两位老师参观了地化所相关实验仪器平台，并期待与天体中心展开进一步的合作。



研讨会现场

报告人简介：

姚文清为清华大学分析中心高级工程师，任国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心副主任，国际标准化委员会表面化学分析分委员会(ISO/TC201)委员,全国微束分析标准化委员会表面化学分析分技术委员会(SC/TC38)副主任等职。主要从事纳米薄膜材料表面化学结构及环境催化材料的高效技术研究，承担和参与973、863、基金委多项国家任务，研制国际和国家标准10项，发表SCI论文80余篇，多次获得国家 and 部级科技奖。

李展平为清华大学分析中心高级工程师，曾任ULVAC-PHI株式会社俄歇电子能谱(AES)、X-光电子能谱(XPS)、二次离子质谱(SIMS)分析实验室主事(专家)。2006年人才引进至清华大学分析中心，主要利用AES、XPS、SIMS等表面分析技术从事固体材料表面分析、结构表征等研究。已发表学术论文三十多篇。

(吴焱学/供稿)



